

FE-3000ユーザーの方へ  
**OPTM series** へ  
リプレイスしませんか？

膜の高精度nk解析にも /



従来を超える 高精度 速い 便利

# 顕微分光膜厚計

OPTICAL THICKNESS METER OPTM Series

FE-3000の高精度測定をさらに上回る **スーパー高精度**

高精度

複数点解析法により

薄膜でのnk解析の

精度 **UP**

低反射率サンプル測定可能

従来の

**感度4倍**

従来よりも  
お求めやすい価格に  
なりました

2017 8/1 ▶ 2018 12/31

詳しくはお問合わせ  
ください。

速い

オートフォーカス時間

**大幅短縮**

わずか  
**0.1秒**

従来

時間

OPTM

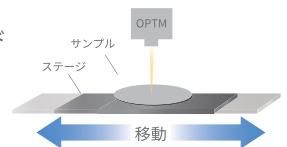
約  $\frac{1}{10}$

短縮

ステージ移動スピード

従来の

**2倍**



便利

楽々解析ウィザード搭載  
初めての方でも  
nk解析ができる



使用頻度の高い設定をマクロ機能で登録

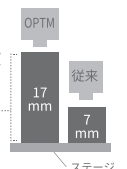
日々の作業が

**手軽に。**

対象となる試料寸法(高さ)を拡大

従来の

**2倍以上**



## Si上SiO<sub>2</sub>膜 約100nmにおいて性能比較

	FE-3000 (従来)	OPTM
繰り返し性 (3σ)	0.11nm	0.08nm
平均測定時間	7421ms	821ms

精度	従来 0.11nm	OPTM 0.08nm	約 1.5倍
時間	従来 7.4sec	OPTM 0.8sec	約 1/10

※定連続20回 (オートフォーカス⇒測定⇒解析までの一連の流れ)  
※VLSIの標準試料 (FTS4-1000)における反射スペクトル測定

## 顕微下で広い測定波長範囲を実現する光学系



	OPTM-A1	OPTM-A2	OPTM-A3
波長範囲	230 ~ 800nm	360 ~ 1100nm	900 ~ 1600nm
膜厚範囲	1nm ~ 35μm	7nm ~ 49μm	16nm ~ 92μm
特長	極薄膜測定	汎用測定	色付き/厚膜測定

膜厚範囲はSiO<sub>2</sub>換算となります。

## 特典

安心サポートの  
ご提供

装置更新に際して、こんな“不安”はございませんか？

Q1

せっかく作ったレシピの  
再設定方法が良く分からない…。

Q2

これまでのデータが  
確認できなくなるのでは…？

A: お客様の大切なレシピを装置更新時にしっかり引き継ぐことができます。

## レシピ移行作業トレーニング & FE-3000 ポスト解析のご提供 (無償)

### 1 レシピ移行作業トレーニング

Q1 のお悩みの方におすすめです。

お客様に“新装置へのレシピ移行作業”や“その後の操作”をスムーズに行っていただくために、納品時に操作手順のトレーニングサポートをいたします。



### 2 FE-3000 ポスト解析ソフトウェアの提供

Q2 のお悩みの方におすすめです。

FE-3000リプレイス後(装置本体がない場合)でもお手持ちのPCで過去のデータが解析できるソフトウェアを提供します。

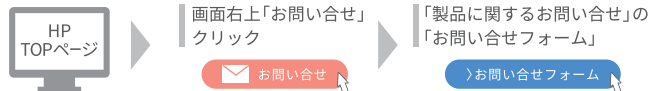


ご質問・ご相談など  
お気軽にお問い合わせください

右に添付の名刺または下記に記載の連絡先までお問い合わせください。  
また、HPからもお問い合わせいただけます。

お問い合わせの際は「FE-3000リプレイスのチラシを見た」とお伝えいただくとスムーズです。

HPからの場合



担当営業  
名刺添付欄

# 大塚電子株式会社

<http://www.otsukael.jp/>

■東北営業所: TEL.(022)208-9645 FAX.(022)208-9675  
■九州営業所: TEL.(092)717-3338 FAX.(092)717-3339  
■東海営業所: TEL.(052)269-8477 FAX.(052)269-8478

■大阪本部・営業部  
〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通3丁目1-2 エスリードビル大手通6F  
TEL.(06)6910-6522 FAX.(06)6910-6528  
■東京支店  
〒192-0082 東京都八王子市東町1-6 橋完LKビル4F  
TEL.(042)644-4951 FAX.(042)644-4961

17.08.16